

技術代行 単価表（所外向け）

2025年6月1日 産業技術総合研究所 分析施設

下記課金額に運営管理費15%および消費税10%を乗じた額が支払金額になります。

電子顕微鏡 1：Tecnai Osiris つくば中央 5 群

利用内容		課金単位	課金額（円、税抜き）
【技術代行（依頼観察）】	基本料金（S/TEM観察、EDS元素マッピング）	1日	350,000
【技術代行（依頼観察・追加）】	STEM-EELSスペクトル計測（解析含む）	1試料（標準時間8時間※）	200,000
	クライオ観察	1回	200,000
	トモグラフィー観察（3Dデータ構築まで）	1視野	200,000

電子顕微鏡 2：JEM-ARM200F つくば中央 5 群

【技術代行（依頼観察）】	基本料金（S/TEM観察）	1日	150,000
【技術代行（依頼観察・追加）】	STEM-EELSスペクトル計測（解析含む）	1視野	100,000
	STEM-EDSスペクトル計測	1視野	100,000
	STEM元素マッピング（EELSまたはEDS）	1視野	200,000
	特殊観察（in-situ 冷却、加熱、時間分割） §	1視野	200,000

電子顕微鏡 3 §：ソフトマター観察用低加速電圧対応高分解能透過型電子顕微鏡 つくば中央 5 群

【技術代行（依頼観察）】	TEM観察	1セッション *	200,000
	STEM観察	1セッション *	300,000
【技術代行（依頼観察・追加）】	特殊試料ホルダ使用（加熱・ベリリウム）	1セッション *	100,000
	特殊試料ホルダ使用（冷却）	1セッション *	200,000
	スペクトル計測（EDS、EELSのいずれか一方）	1視野	100,000
	スペクトル計測（EDS、EELSの両方）	1視野	160,000
	STEM元素マッピング（EDS、EELSのいずれか）	1視野	200,000
	STEM元素マッピング（EDS、EELSの両方）	1視野	320,000

電子顕微鏡試料作製装置 つくば中央 5 群

【技術代行（試料作製等）】	FIB加工、電子顕微鏡用試料作製	半日（1枠） Γ	40,000
	ウルトラマイクローム法	1時間	10,000
	クライオウルトラマイクローム法	1時間	50,000
	Arイオンミリング法	1時間	12,000
	急速凍結法 §（Vitrobot, Quantifoil 1枚含む）	1試料	100,000
	溶液法 §（Ma-tek社製TEMグリッド1枚含む）	1試料	100,000

上記以外のオプション料金

【運転費】 §	業務クラス 2（研究グループ長級等）	1時間	40,000
	業務クラス 3（主任研究員級等）	1時間	30,000
【技術指導費】	画像等データ解析・評価料	1試料（標準時間4時間※）	100,000
	EELS結果解釈（先行研究・データベース調査）	1回（標準時間8時間※）	200,000
【加算実費】	ア 改造費、イ 復元費、ウ 他の共用施設等の利用に係る経費、エ 研究所以外の機		実費を請求

産総研外に公開されていないサービスを所外ユーザーが利用するには産総研と技術コンサルティングや共同研究契約を結ぶ必要があります。詳細は産総研分析施設事務局（M-denken01-ml@aist.go.jp）まで御連絡ください。

- ※ 標準時間を超過する場合、試料複数個分課金額として請求することがあります。
- § 電子顕微鏡 2 のin-situ冷却、電子顕微鏡 3 の全項目、試料作製での急速凍結法および溶液法では、オプション料金の運転費を別途計上します。
- * 1セッション内でのSTEM/TEM変更、試料交換なし。測定項目により数時間～最大8時間（1日）。
- Γ 標準時間はTEM用試料作製の場合1.5日（3枠）、SEM用試料作製の場合1.0日（2枠）。